

# NDIS 意見受付

NDIS2002 フェーズドアレイ超音波探傷試験用語  
原案作成委員会

この NDIS は「日本非破壊検査協会規格（NDIS）制定等に関する規則」に基づき関係者に NDIS の制定前の意見提出期間を設けるために掲載するものです。

意見は規格原案決定の際の参考として取り扱いさせていただきます。

掲載されている NDIS についての意見提出は次に示すメールアドレスまでお願いいたします。

意見受付締切日：2021 年 10 月 8 日（金）

意見提出先：Email：bsn@jsndi.or.jp

---

## 目次

	ページ
1 適用範囲 .....	1
2 引用規格 .....	1
3 分類 .....	1
4 一般事項 .....	1
4.1 番号の付け方 .....	1
4.2 用語の順序 .....	1
4.3 対応英語 .....	1
4.4 括弧の使い方 .....	1
5 用語及び定義 .....	2

## まえがき

この規格は、日本非破壊検査協会規格（NDIS）制定などに関する規則に基づき、標準化委員会の審議を経て、（一社）日本非破壊検査協会が制定した規格である。この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。（一社）日本非破壊検査協会は、このような特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に関わる確認について、責任はもたない。

この規格を適用する責任は、この規格の使用者に帰する。また、規格を適用した場合に生じるかもしれない安全上又は衛生上の諸問題に関しては、この規格の適用範囲外である。この規格の適用に際して、安全上又は衛生上の規定が必要な場合は、この規格の使用者の責任で、安全又は衛生に関する、規格又は指針などを併用しなければならない。

# 日本非破壊検査協会規格

NDIS 2002 : 20XX

## フェーズドアレイ超音波探傷試験用語 Terms and definitions of phased array ultrasonic testing

### 1 適用範囲

この規格は、フェーズドアレイ超音波探傷試験に関する用語とその定義について規定する。

### 2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

**JIS Z 2300** 非破壊試験用語

### 3 分類

用語の分類は次による。

- a) 一般
- b) 機器・材料
- c) 試験方法

### 4 一般事項

#### 4.1 番号の付け方

番号は4けたとし、1000の位の数字が分類を表す。一般は0001から、機器・材料は1001から、試験方法は2001から始める。

#### 4.2 用語の順序

用語は分類ごと五十音順に並べる。一つの用語欄に二つ以上の用語が併記してある場合は、記載されている順位に従って優先的に使用する。

#### 4.3 対応英語

対応英語は参考として示す。

なお、対応英語の後の“\*”印はEN 16018で規定されている用語を示す。

#### 4.4 括弧の使い方

28 丸括弧“( )”を用いる。直前の語句又は文章に対する説明若しくは補足を示す場合に、丸括弧“( )”  
 29 を用いる。

30 **5 用語及び定義**

31 用語の後の“\*”印は JIS Z 2300 で規定されている用語を示す。

32

表 1—一般

番号	用語	定義	対応英語 (参考)
0001	アレイの第 1 軸	素子幅に平行にビーム走査するときの中心軸。(図 1 参照)	primary axis of an array*
0002	アレイの第 2 軸	アレイの第 1 軸に直交する方向の軸。(図 1 参照)	secondary axis of an array*
0003	A スコープ処理速度 (AAR 又は ASR)	一つの受信 A スコープを得るに必要な処理速度 (Hz)。(図 2 参照)	A-scope acquisition rate
0004	フェーズドアレイの A スコープ表示* フェーズドアレイの基本表示*	超音波受信信号の振幅を縦軸、時間 (距離) を横軸にした波形表示。なお、一般に向きを右回りに 90 度回転させた表示方法が用いられることもある。	A-scope A-scan
0005	サイクル	1 送信パルス (又は 1A スコープを構成するために必要な複数の送信パルス) にて制御・生成される素子群による超音波の送受信。複数のサイクルによって断面画像を作成する。(図 2 参照)	cycle(s)
0006	フェーズドアレイの C スコープ表示* フェーズドアレイの平面表示*	超音波ビームを走査して得られる平面画像表示。(図 3 参照)	C-scope C-scan
0007	信号の合成	ディレイロー適用後の素子の受信信号を足し合わせる処理をした結果。	sum of signals*
0008	フェーズドアレイの走査* スキャン	電子走査 (2005) 及び機械走査 (2002) を含む超音波ビームを動かす方法。	scan
0009	フェーズドアレイの D スコープ表示	B スコープと直交する断面画像表示。(図 3 参照)	D-scope D-scan
0010	B スコープ処理速度 (BAR 又は BSR) 探傷繰返し周波数	一つの B スコープを得るに必要な処理速度 (Hz)。(図 2 参照)	B-scope acquisition rate
0011	フェーズドアレイの B スコープ表示* フェーズドアレイの断面表示*	超音波ビームを走査して得られる断面画像表示。(図 3 参照)	B-scope B-scan
0012	ビームステアリング ステアリング	超音波ビームを順次偏向させること。セクタ走査に使われる。(図 4 参照)	beam steering
0013	ビームフォーカシング フォーカシング フォーカス方式	一つ又は幾つかの焦点で超音波ビームを集束させる方法。(図 5 参照)	beam focusing
0014	フェーズドアレイ法 フェーズドアレイ超音波法 フェーズドアレイ超音波探傷試験	複数の素子から音波を放射するタイミング (波の位相) を電子的に制御することによって超音波ビームを形成する方法。また受信信号においても複数の素子で受信した信号の位相を電子的に制御し受信波形を形成する方法。(図 6 参照) <b>注記</b> 探触子を構成する個々のエレメントを、JIS Z 2300:2020 では振動子としているが、ここではフェーズドアレイ特有の用語として、1022 に定義した素子を用いた。	phased array technique phased array ultrasonic testing

番号	用語	定義	対応英語 (参考)
0015	リフレッシュレート 表示繰返し周波数	表示器に B スコープを表示する速度 (Hz)。 (図 2 参照)	refresh rate

33

表 2-機器・材料

番号	用語	定義	対応英語 (参考)
1001	アクティブアパチャ バーチャルアパチャ	アレイ探触子で送信又は受信する動的素子の総幅。	active aperture, virtual aperture
1002	アニュラアレイ探触子	主たる伝搬軸に対してリング状の素子が同心軸上に配列された探触子。(図 7 参照)	annular array probe*
1003	アパチャ 開口	アレイ探触子の音響放射面。アレイ探触子では素子の総幅を意味する。(図 8 参照)	aperture
1004	ウェッジ音速	ウェッジ中の音波の速度。通常縦波音速をいう。	wedge velocity
1005	ウェッジ角	斜角探傷に使用するウェッジの幾何学的な入射角度。(図 9 参照)	wedge angle
1006	ACG 角度感度補正	セクタスキャンにおける、ある一定深さのフォーカルローゴとのゲインの補正。	angle corrected gain
1007	エッジオフセット高さ	斜角アレイ素子配列の最下部素子と接触面までの寸法。(図 9 参照)	edge offset height, height of the first element
1008	凹状アレイ探触子	輪状 (円弧状) アレイで、一般にチューブ外面のような凸の曲面からの検査に使用する探触子。(図 7 参照)	concave array probe*
1009	角度ステップ	セクタスキャンのフォーカルロー偏向角度ピッチ	angle step
1010	グレーティングローブ	アレイ探触子の素子の配列, 寸法, 間隔及び超音波の波長との関係によって主方向 (メインローブ) 以外に生じる不要なローブ。(図 10 参照)	grating lobe
1011	くさびの参照点	アレイの位置を定義するために用いられる, くさびの座標軸上の点。	reference point on the wedge*
1012	クロストーク	素子間の音響的及び/又は電気的な漏洩。	crosstalk
1013	サイドローブ	音場において主方向 (メインローブ) 以外に生じるローブ。	side lobe
1014	受信ディレイ	受信信号の遅延時間。フェーズドアレイにおいて, 各素子で受信した信号の遅延を行い, 1 つの合成受信波形とする。	receiver delay receiving delay*
1015	受信フォーカルロー	各素子から得られた受信 A スコープに与える遅延設定, 合成方法など。この設定によって評価に必要な A スコープが得られる。	receiving focal law
1016	スキャン開始素子	スキャンサイクルにおいて, 使用する素子群の最初の素子 (番号付けされたものはその最初の番号)。	start element
1017	スキャン終了素子	スキャンサイクルにおいて, 使用する素子群の最後の素子 (番号付けされたものはその最後の番号)。	stop element end element
1018	ステアリング偏向角度範囲	ビームステアリングの超音波ビーム偏向の最小角度から最大角度までの範囲。	steering limit steering range*
1019	送信ディレイ	送信パルスの遅延時間。フェーズドアレイにおいてビームを偏向及び/又は集束させるために各素子に印加するパルスの遅延を行う。	pulse delay transmitting delay*
1020	送信フォーカルロー	送信波を生成するための電圧設定, 遅延設定, 合成方法など。	transmitting focal law
1021	総接続素子数	フェーズドアレイ探傷器に接続可能な総素子数。	physical elements (probe)
1022	素子 エレメント	アレイ探触子を構成する振動子の最小単位。	element(s)
1023	素子感度補正 エレメントキャリブレーション エレメントノーマライゼーション	アレイ探触子の素子間感度差を補正する機能。一般的に平面反射源からのエコー高さ情報を基に行う。	elements calibration, elements normalization

番号	用語	定義	対応英語 (参考)
1024	素子ギャップ	隣り合う2つの素子の隙間寸法。(図8参照)	element gap
1025	素子数	アレイ探触子を構成する素子の総数。(図8参照)	number of Elements
1026	素子ステップ	リニアスキャンの時のスキャンピッチ。	element step
1027	素子長さ パッシブアパチャー エレベーション	素子幅と直交する方向の寸法。(図8参照)	element length, passive aperture, elevation
1028	素子配列	ウェッジに対する素子の分布の方向。(図11参照)	element alignment arrangement of the array*
1029	素子幅	アレイ探触子を構成する素子の幅。(図8参照)	element width
1030	素子ピッチ	隣り合う2つの素子の中心又は同じ側の端の間隔。 (図8参照)	element pitch pitch*
1031	ゾーンフォーカス マルチプルフォーカ ス	送受信の焦点を同一とし送受信ごとに順次焦点距離 を変えながら探傷する方法。	zone focus multiple focus
1032	ダイナミックデプス フォーカス DDF	ビームフォーカシングの中で1送信後の受信処理で 深さ方向に複数の焦点をもたせる方法。 (図12参照)	dynamic depth focus (ing), variable aperture control
1033	チルティング	主として平面試験体において、試験体表面で偏向面 をその軌跡周りにおいて回転させること。(図13参 照)	tilting*
1034	チルト角	試験体表面の垂線と偏向に対するその投影方向のな す角度。(図13参照)	tilt angle*
1035	チルト範囲	チルト角の範囲。(図13参照)	tilt range*
1036	チャンネル	送信(送信チャンネル)及び/又は受信(受信チャン ネル)に対する試験装置の通路。	channel*
1037	中央オフセット高さ	斜角アレイ素子配列の中央と接触面までの寸法。 (図9参照)	center offset height
1038	TCG	電子的に行う距離振幅補償。EDACと同義。	time corrected gain
1039	同時駆動素子数	フェーズドアレイ探傷器で同時に駆動する素子数。	virtual elements (probe)
1040	同時受信素子数	フェーズドアレイ探傷器で同時に受信する素子数。	virtual elements (probe)
1041	デッドエレメント (無効素子)	アレイにおいてもはや作動しない素子。	dead element*
1042	凸状アレイ探触子	輪状(円弧状)アレイで、一般にチューブ内面の一 様な凹の曲面からの検査に使用する探触子。(図7 参照)	convex array probe*
1043	二分割(デュアル) アレイ探触子	送信と受信を別々に分けたアレイ探触子。(図7参 照)	dual array probe*
1044	ねじれ(スキューイ ング)	主として平面試験体において、試験体表面の垂線の 周りで、ある角度で偏向面を回転すること。(図13参 照)	skewing*
1045	ねじれ角	試験の表面において自然屈折の面と偏向面の軌跡と がなす角。(図13参照)	skew angle*
1046	ねじれ範囲(スキュー イング範囲)	ねじれ角の範囲(図13参照)	skewing range*
1047	バーチャルインデッ クスポイント	ウェッジ付きのフェーズドアレイ探触子で振動子の 開口に対する入射点。(開口の中心点に対する入射 点)(図9参照)	virtual beam index point
1048	フェーズドアレイ探 傷器	フェーズドアレイ探触子を操作させるために用いる 多チャンネル装置。	phased array instrument*

番号	用語	定義	対応英語 (参考)
1049	フェーズドアレイ探触子* アレイ探触子	複数個の素子で構成され、それらを異なった振幅又は位相で独立して作動し、その結果、種々のビームの角度及び集束範囲を制御できる探触子。(図7参照) <b>注記</b> 探触子を構成する個々のエレメントを、JIS Z 2300:2020では振動子としているが、ここではフェーズドアレイ特有の用語として、1022に定義した素子を用いた。	Phased array probe
1050	フォーカルローディレイロー	フェーズドアレイの動作に必要な、各素子に設定する送信や受信のディレイや電圧などのソフトウェア、ハードウェア上の全ての設定。	focal law delay law
1051	マトリックスアレイ探触子	複数個の素子が格子状に並んだ探触子。(図7参照)	matrix array probe,
1052	メインローブ	超音波の主方向のビームで、主極とも呼ばれ超音波ビームの指向性の方向を示す。(図10参照)	main lobe
1053	リニアアレイ探触子	素子が直線状に並んだ探触子。(図7参照)	linear array probe,
1054	輪状アレイ探触子, 円弧状アレイ探触子	主たる伝搬軸が半径方向で、完全又は部分的に輪状に配列した探触子。凸状アレイ探触子、凹状アレイ探触子などがある。(図7参照)	encircling array probe*
1055	ローブ	超音波ビームの音圧の高い方向に伸びる輪形のパターン。	lobe

表3-試験方法

番号	用語	定義	対応英語 (参考)
2001	アダプティブフォーカス	参照ショットからの信号の遅延計算に基づいた反復電子フォーカス。	adaptive focusing*
2002	機械走査	アレイ探触子を機械的に走査すること。自動及び手動の両方の走査を含む。	mechanical scan
2003	スキャンプラン	仕様書、規格、コード等で要求される試験内容を基に、その目的を達成するための探触子の最適走査方法に対する規定。	scan plan
2004	フェーズドアレイのセクタ走査 セクタスキャン	アレイ探触子を構成する複数の素子(通常8素子以上)の個々の駆動タイミング(位相)を制御し超音波ビームの方向を変える方式。ビームを扇形に走査することからセクタスキャンと呼ばれる。斜角探傷にはほとんどこの方式が用いられる。(図14参照) <b>注記</b> 探触子を構成する個々のエレメントを、JIS Z 2300:2020では振動子としているが、ここではフェーズドアレイ特有の用語として、1022に定義した素子を用いた。	sector scan, sectorial scan sectorial electronic scanning*
2005	電子走査	アレイ探触子の複数の素子を電子的に切り替えて超音波ビームを走査する方式の総称。	electronic scan electronic scanning*
2006	トータルフォーカシングメソッド TFM	フルマトリックスキャプチャで得られた全てのデータに基づいて、それらの振幅及びTOFの情報を総合したイメージフレームで画像を再構築する方法。	total focusing method
2007	ビーム形成	アレイ探触子によって超音波ビーム形成を制御する方法。	beam forming electronic beam shaping*
2008	フルマトリックスキャプチャ FMC	アレイ探触子のそれぞれの素子を連続的に送信に用いて、それぞれの送信波に対して全ての素子を受信に用いて、特定のデータ採取及び処理を実施する方法。	full matrix capture*

番号	用語	定義	対応英語 (参考)
2009	フェーズドアレイの ニア走査 リニアスキャン	アレイ探触子の素子を電子的に切り替えてビームを形成し、複数のビームによって探傷画像を作成する方法。一般的にフォーカルローを変えずに素子の切替をする。(図 15 参照) <b>注記</b> 探触子を構成する個々のエレメントを、JIS Z 2300:2020 では振動子としているが、ここではフェーズドアレイ特有の用語として、1022 に定義した素子を用いた。	linear scan linear electronic scanning*

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

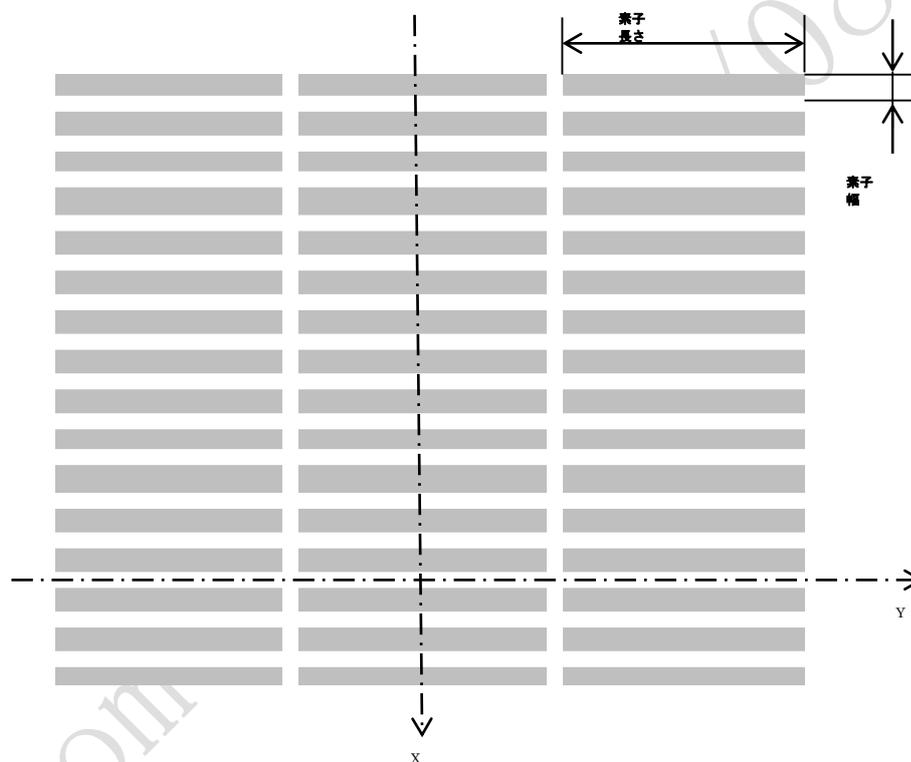


図 1—マトリックスアレイの軸

58

フェーズドアレイ探傷器の動作周期の種類 解説図

59

条件 フェーズドアレイ法によるセクタ走査を例とする

60

等価サンプリング無し

サイクル数=8 セクタ走査 40度~47度の例

61

メインクロック(送信波繰返し周波数、Aスコープ処理速度)=800Hz

Bスコープ処理速度=800÷8=100Hz

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

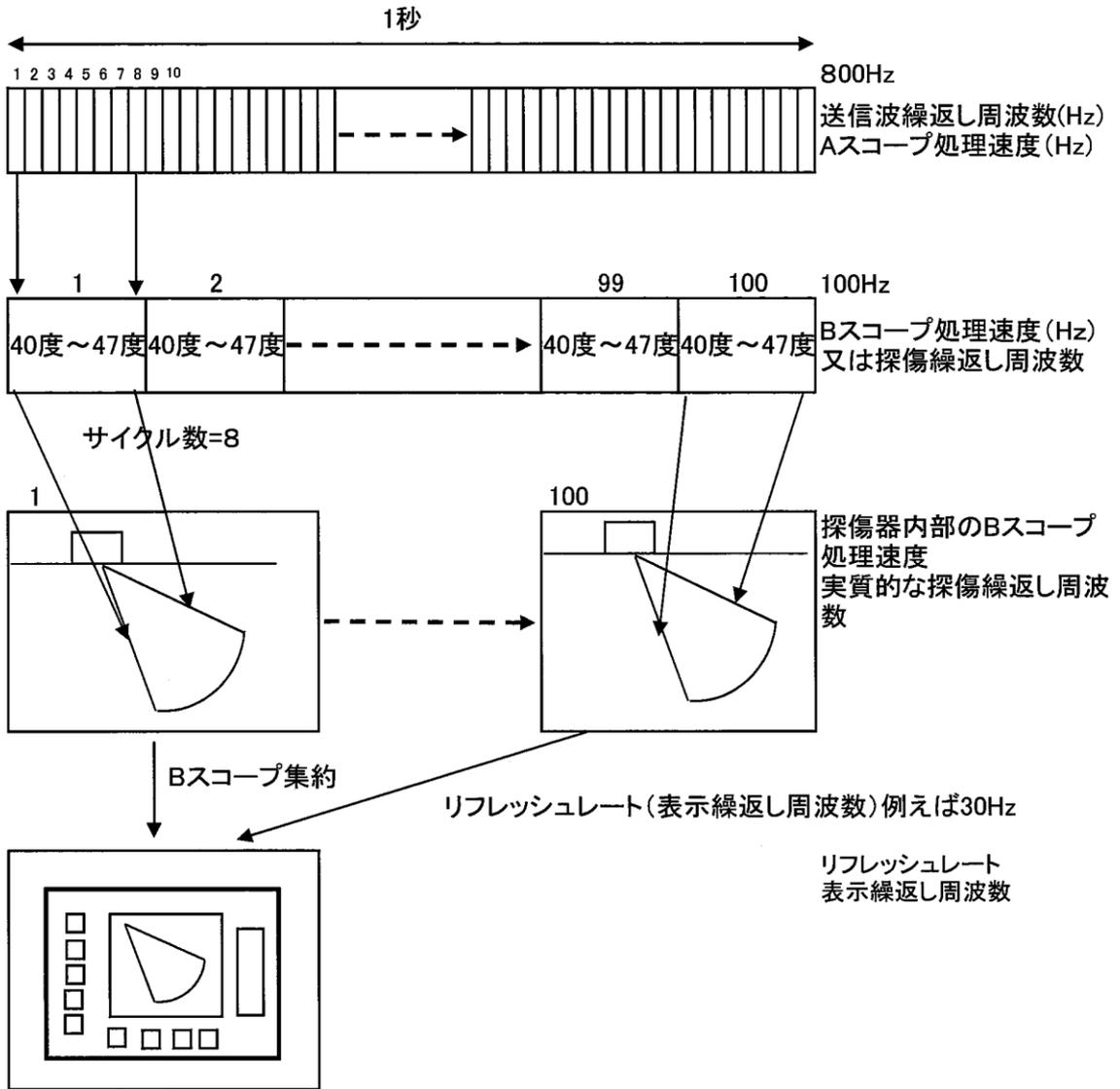
75

76

77

78

79



80

この例では等価サンプリングが無い為、送信波繰返し周波数とAスコープ処理速度は同じ。  
しかし等価サンプリングや移動平均などの処理のある場合は、実質的な送信波繰返し周波数とA  
スコープ処理速度、Bスコープ処理速度を明記する必要がある。

81

82

83

図2-A スコープ処理速度及びBスコープ処理速度の関係

84

85

86

87

88

89

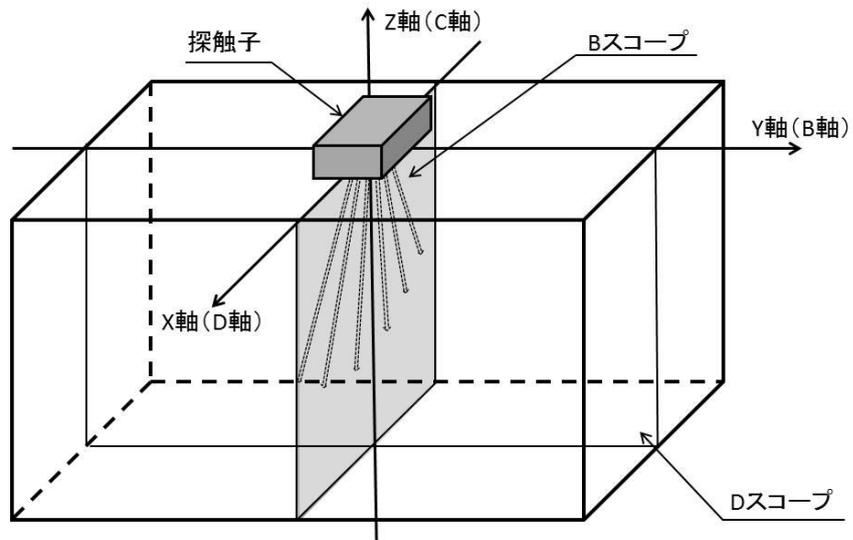
90

91

92

93

94



95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

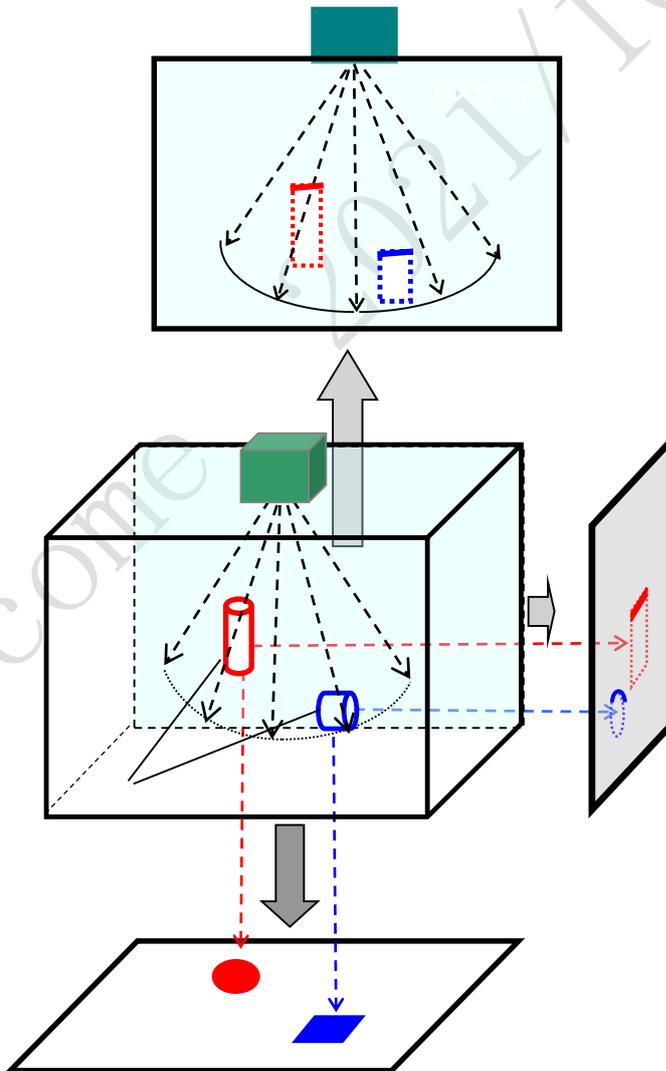


図3-Bスコープ表示, Cスコープ表示及びDスコープ表示

113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140

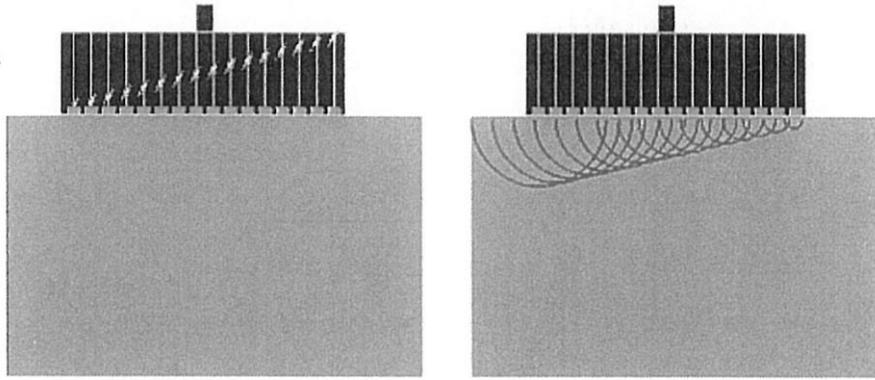


図4—ビームステアリング

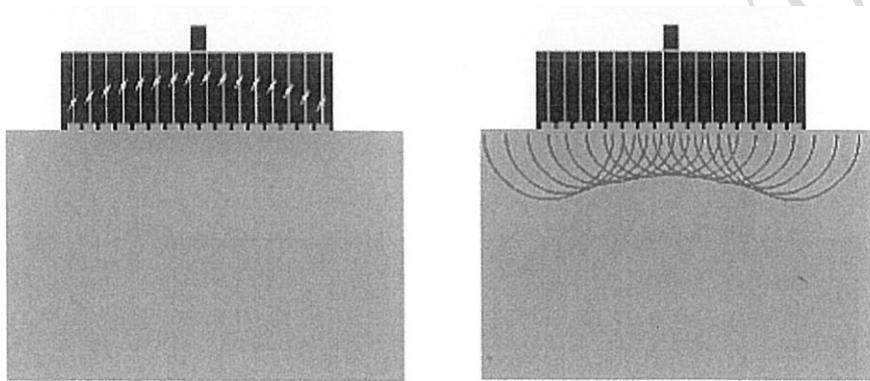


図5—ビームフォーカシング

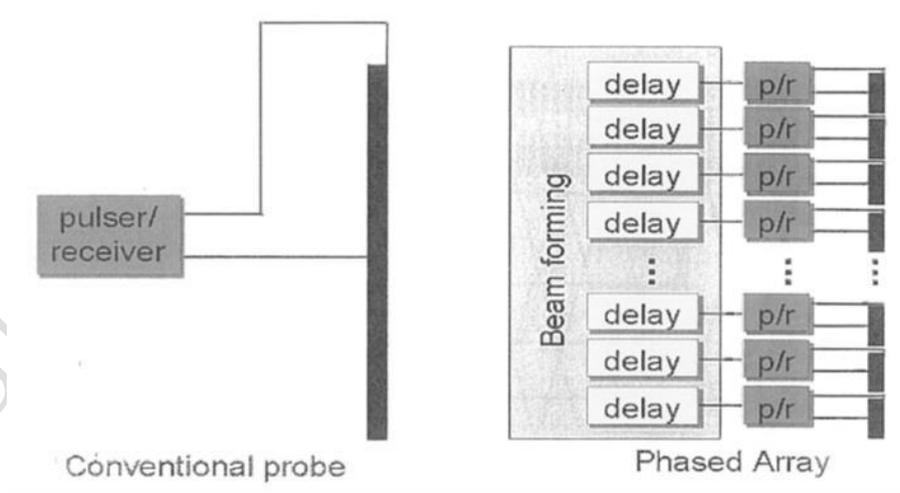


図6—通常の超音波探傷試験方法とフェーズドアレイ超音波法の比較

141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170

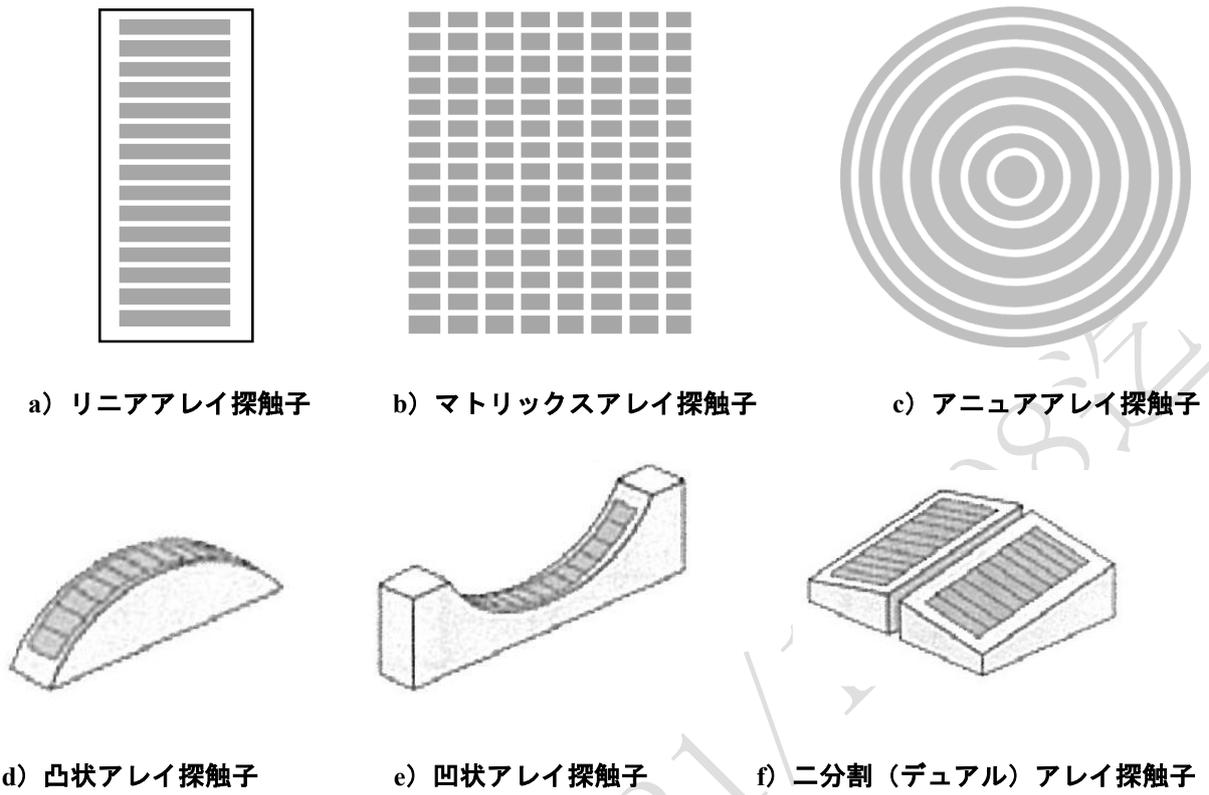


図7-フェーズドアレイ探触子の種類

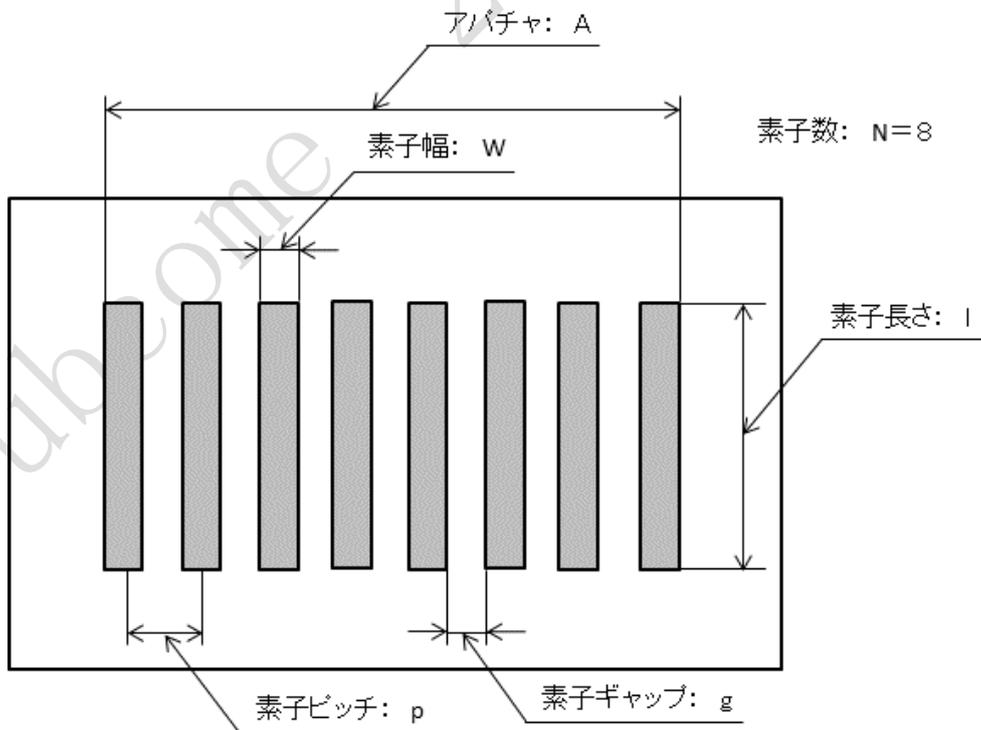


図8-アレイ探触子のアパチャと素子の配置の関係

171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215

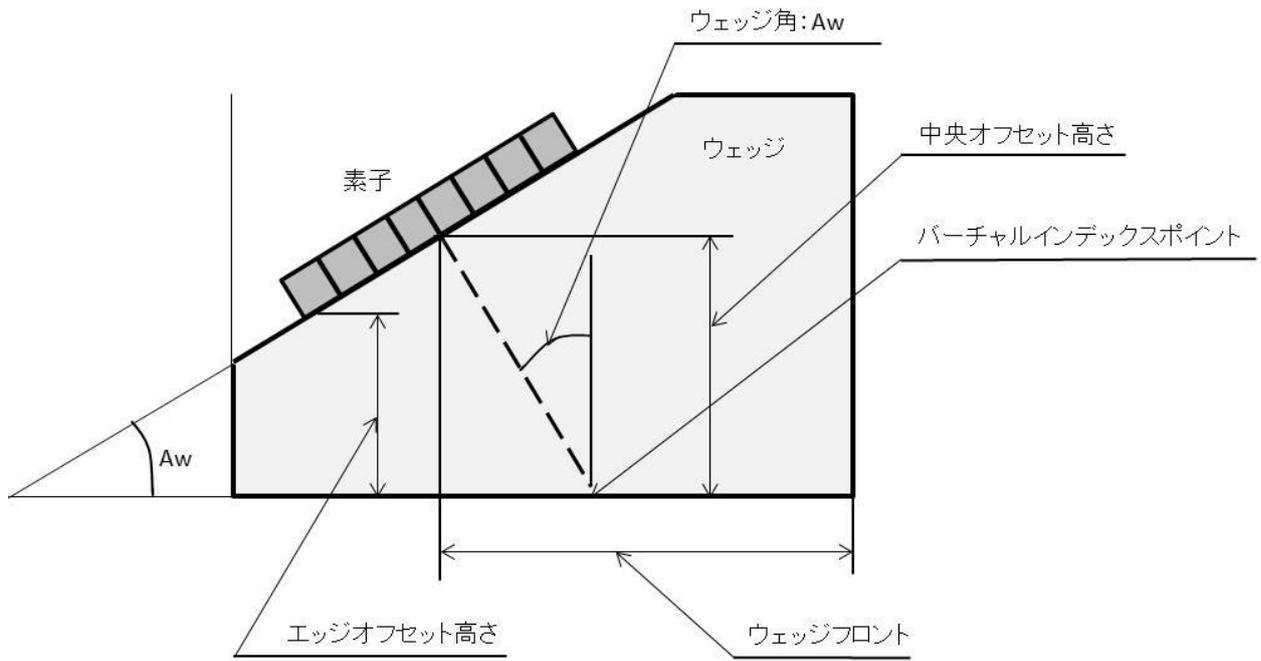


図9-斜角探傷に使用するフェーズドアレイ探触子

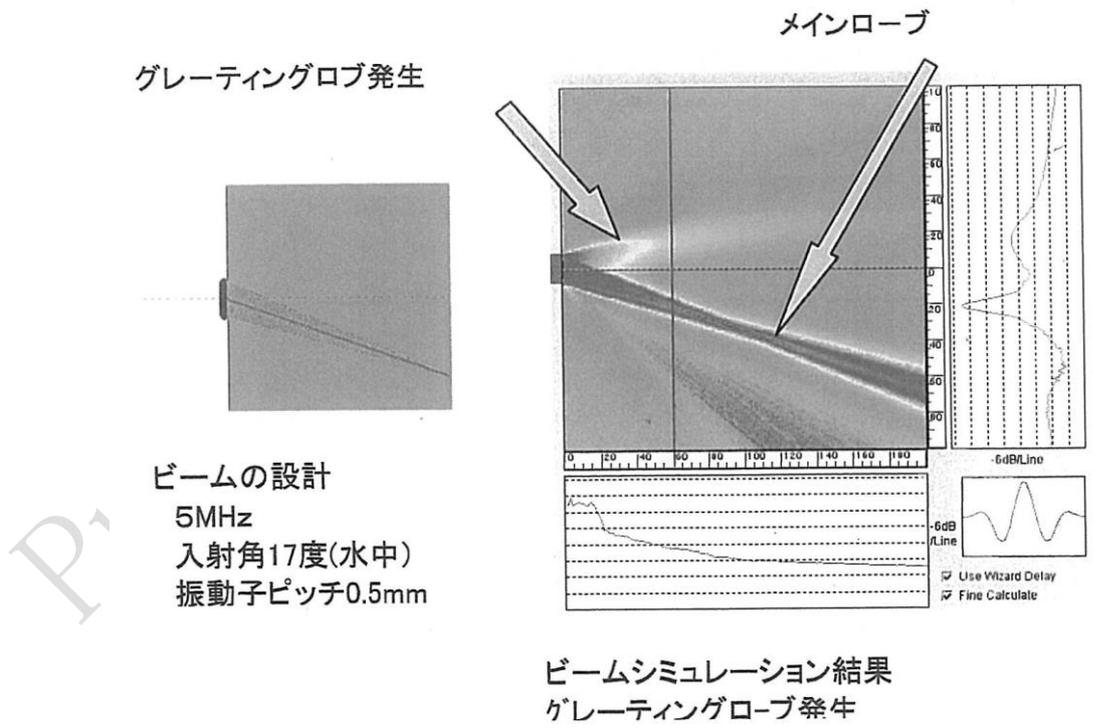


図10-超音波フェーズドアレイの音場

216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260

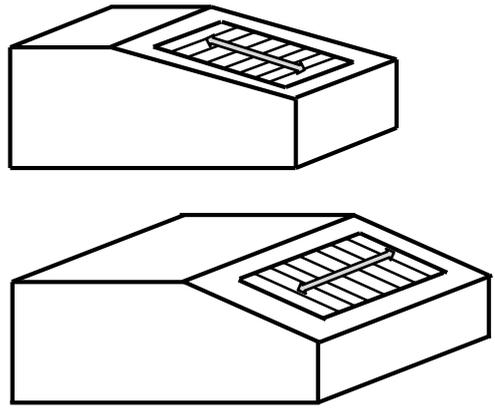


図 11—斜角探傷による素子配列の例

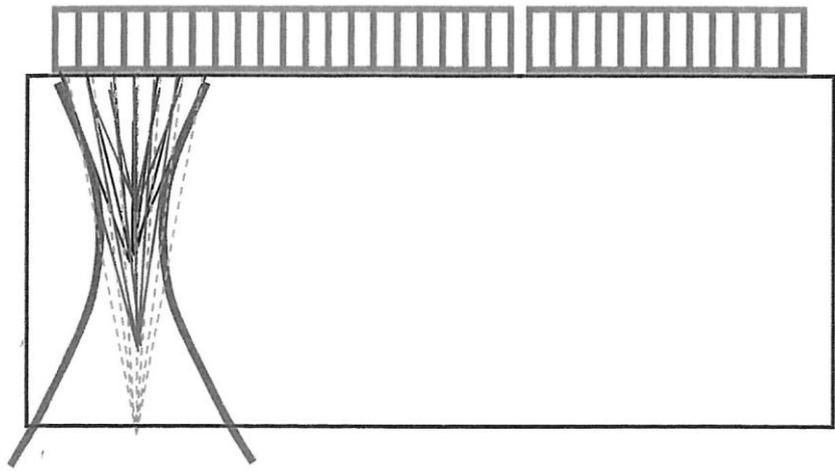
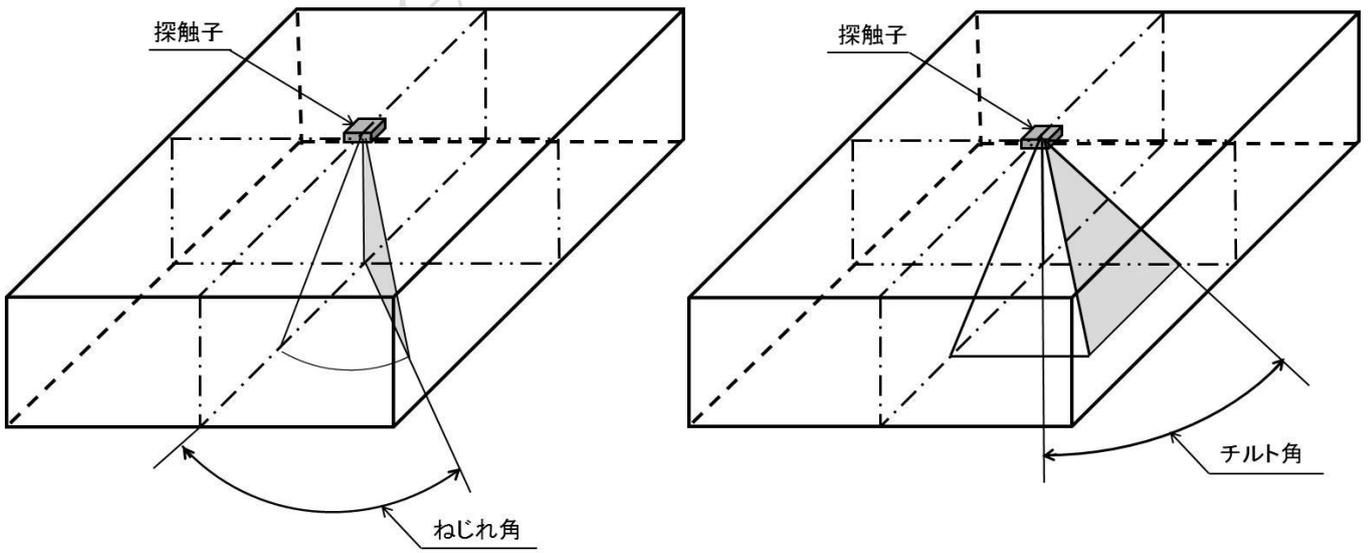


図 12—ダイナミックデプスフォーカス

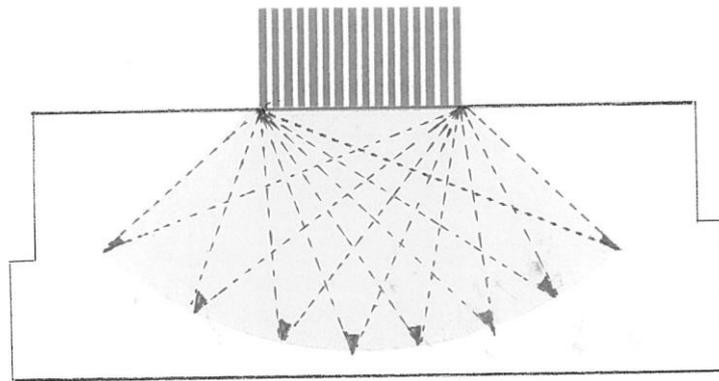


a) ねじれ角

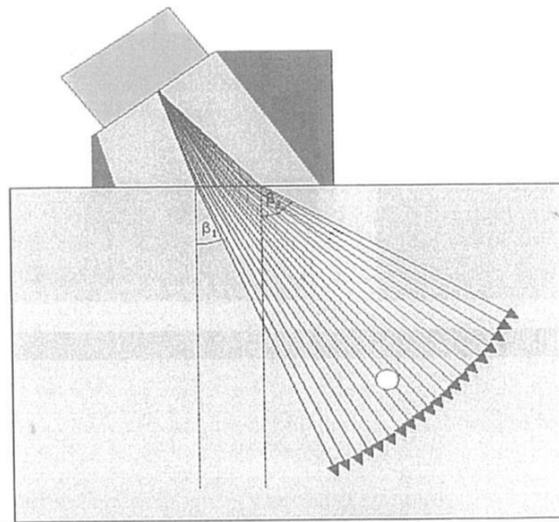
b) チルト角

図 13—ビームのねじれ（スキューイング）とチルティング

261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305



a) 垂直セクタ走査



b) 斜角セクタ走査

図 14—セクタ走査

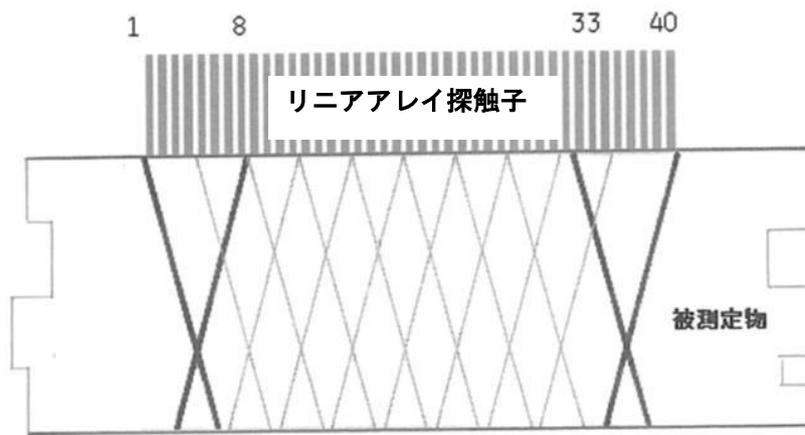


図 15—リニア走査

# フェーズドアレイ超音波探傷試験用語 解説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、一般社団法人日本非破壊検査協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は、一般社団法人日本非破壊検査協会である。

## 1 制定の趣旨

この規格は、フェーズドアレイ法による超音波探傷試験に関する規格として、20XX年X月に制定された。これまで、国内外を問わずメーカーごとに異なる表現が用いられ、また国内では英語による発音をそのままカタカナで表示しただけの場合も多かった。この規格では、海外規格の用語を参考にしながらできるだけ和文を用いて用語を統一すると同時に、使用者に分かりやすい定義を規定するように努めた。

## 2 制定の経緯

一般社団法人日本非破壊検査協会では、2006年11月の超音波分科会で“フェイズドアレイ法規格化の可能性について”をテーマに特別企画を開催した。その翌年の2007年10月に機関誌で特集記事“フェイズドアレイ超音波技術の最近の動向”を掲載すると同時に、12月に超音波分科会の下に“フェイズドアレイ規格検討委員会（三原委員長）”を立ち上げ、適用分野検討WGを3回（2008年3月9日）実施し、各産業分野でのフェイズドアレイ超音波の実施状況及び海外規格の動向と国内での規格化の要望などを調査した。その後、2009年5月技術要件抽出WGを立ち上げ、関連する用語の取りまとめを非破壊検査工業会機器部会へ委託した。

上記の経緯を経て得られた成果を基に2012年5月、標準化委員会超音波専門別委員会の下に“超音波フェーズドアレイ非破壊試験用語”のNDIS原案作成準備WGを設置した。一方、2009年に制定されたJIS Z 2300（非破壊試験用語）では、“フェイズドアレイ”ではなく“フェーズドアレイ”が正式用語として採用されたため、それ以降は“フェーズドアレイ”という表現で統一することとした。

2012年8月から2013年6月にかけてNDIS原案作成準備WGを6回開催しNDISの素案を作成した。また並行して検討されているフェーズドアレイ関連のISOの制定、JISの改正など関連規格の動向を考慮に入れながら、NDIS原案作成委員会の立上げ時期を検討した。一方、同じ時期の2012年ダーバンでのISO/TC135/SC3の会議では、ISO 5577の改正に併せて新たにフェーズドアレイ UT の用語のISOを新規制定することの提案があった。しかしながら、その後ISO 5577では、“フェーズドアレイ UT 用語についてはEN 16018:2011を引用すること”が2017年改正版に明記され、フェーズドアレイ UT 用語のISOの制定は見送られた。

このような経緯を経て2017年2月、標準化委員会超音波専門別委員会の下に“超音波フェーズドアレイ試験用語”のNDIS原案作成委員会を発足させ、2017年10月まで委員会を4回開催し審議を重ねた。その後、202X年X月の標準化委員会の審議を経て、202X年X月に制定された。

### 340 3 審議中に特に問題となった事項

341 審議中に問題となった事項は、次のとおりである。

342 a) **JIS Z 2300 及び NDIS 2001 との整合について** JIS Z 2300 及び NDIS 2001 で既に定義されている用語  
343 であっても、フェーズドアレイ法に特有の意味を持たせて使用されているものについては、新たな定  
344 義を規定して用語として採用した。

345 b) **定義の体言止めについて** 表現をより明確にするため、全ての用語について最初の定義を体言止めで  
346 統一することとした。

347 なお、追記する注意書きに対しては、特に体言止めは用いなかった。

348 c) **“素子”と“振動子”との使い分けについて** アレイ探触子を構成する最小エレメントを示す用語と  
349 て、素子及び振動子の両方が用いられている。一般に素子を用いる場合が多いが、JIS Z 2300 ではフ  
350 ェーズドアレイ探触子の用語の定義で“複数個の振動子で構成され…”と表現され、素子と同じ意味  
351 で振動子が用いられている。一方で、超音波を発生させる素子群を振動子と呼ぶ場合もあり、あまり  
352 厳密に使い分けられていないのが実情である。

353 今回制定する NDIS 2002 はフェーズドアレイ法に限定した用語規格であり、通常の超音波探傷試験  
354 のように単体の振動子を探触子として用いる場合とは異なることから、JIS Z 2300 とは整合しないこ  
355 とになるが、あえて“素子”という用語で統一することとした。

356 d) **表題について** この原案で定義されている 0014 のフェーズドアレイ法とフェーズドアレイ超音波法  
357 に“フェーズドアレイ超音波探傷試験”を用語として追加し、表題を“フェーズドアレイ超音波探傷  
358 試験用語”とした。

### 359 4 規定項目の内容

360 主な制定内容は、次のとおりである。

361 a) 各メーカー共通の用語、異なる用語を整理し、またカタカナ用語を可能な範囲で和文とし、規格用語と  
362 して適切な文言として、一般、機器・材料及び試験方法に分類して定義した。

363 b) ISO 5577 の改正時に導入されると思われていたフェーズドアレイ関連用語は、EN 16018 を使用する  
364 とのことで ISO 5577 からは除外されたため、海外の参照用語は EN をベースとして進めることとした。

365 c) 審議方針としては、まずそれぞれの用語が必要か否かを確認し、その後に定義を議論してできるだけ  
366 誤った使い方が行われぬように留意した。その結果、一般を 15 語、機器・材料を 55 語、試験方法  
367 を 9 語とした。